



Final Product/Process Change Notification

Document #:FPCN24073X

Issue Date:23 Jul 2021

Title of Change:	Qualification of ON Semiconductor Niigata fab (Japan) and consolidation of Assembly and Test site operations of Small Signal Transistor devices in SOT-23, SSOT3, SOT-223 and SC-70 packages.	
Proposed First Ship date:	30 Oct 2021 or earlier if approved by customer	
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or Jason.Choy@onsemi.com	
PCN Samples Contact:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or < PCN.samples@onsemi.com >. Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.	
Additional Reliability Data:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or Yasuhiro.Igarashi@onsemi.com	
Type of Notification:	This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. FPCNs are issued 90 days prior to implementation of the change. ON Semiconductor will consider this change accepted, unless an inquiry is made in writing within 30 days of delivery of this notice. To do so, contact PCN.Support@onsemi.com	
Marking of Parts/ Traceability of Change:	Customer may receive the parts once FPCN expired or earlier depending on customer approval. Parts from new assembly & test site can be identified through product marking which follow ON Semiconductor marking format.	
Change Category:	Test Change, Assembly Change, Wafer Fab Change	
Change Sub-Category(s):	Manufacturing Site Transfer	
Sites Affected:		
ON Semiconductor Sites		External Foundry/Subcon Sites
Leshan Phoenix Semiconductor, China		AUK Corporation, Korea
ON Semiconductor Cebu, Philippines		JCET, China
ON Semiconductor Niigata, Japan		Phenittec Semiconductor, Japan
ON Semiconductor Seremban, Malaysia		
Description and Purpose:		
<p>This final notification announces the qualification of ON Semiconductor Niigata (Japan) and consolidation of Assembly and Test Site on Small Signal Transistor packaged in SOT-23, SSOT3, SOT-223 and SC-70</p> <p>This change was resulted in Phenittec 5in fab closure. The ON Semiconductor Niigata and all assembly and test sites has been an existing qualified manufacturing site for ON Semiconductor which certified with ISO/TS 16949:2009.</p> <p>Products listed in this notification will continue to be Pb-free, Halide free and RoHS compliant. Qualification tests are designed to show that the reliability of the transferred devices will continue to meet or exceed ON Semiconductor standard.</p>		



Site Change:

	Before Change	After Change
Wafer Fab	Phenitec Semiconductor, Japan	Niigata, Japan
Assembly Location	Leshan Phoenix Semiconductor, China / JCET, China / AUK China / ON Semiconductor Cebu, Philippines	Leshan Phoenix Semiconductor, China / JCET, China / ON Semiconductor Cebu, Philippines / ON Semiconductor Seremban, Malaysia
Final Test Location	Leshan Phoenix Semiconductor, China / JCET, China / AUK China / ON Semiconductor Cebu, Philippines	Leshan Phoenix Semiconductor, China / JCET, China / ON Semiconductor Cebu, Philippines / ON Semiconductor Seremban, Malaysia

Fab change:

	Before Change	After Change
Front Metal Type	Al or AlSi	No Change
Back Metal Type	AuAs, AuSb, TiNiAg, TiNiAgSn	Au, TiNiAg, TiNiAgSn

Piece Part Change:

SOT-23

	Before Change	After Change
Leadframe	Alloy42-Ag Plated	JCET / CEBU : Alloy42-Ag Plated LPS : Alloy42-Cu Plated
Die Attach	Eutectic	Eutectic
Mold Compound	LPS : Sumitomo JCET : EDALE ELER-8-100HFE AUK : KCC KTMC1050GR CEBU : MC Green PA CK500A	LPS : Henkel M7A JCET : EDALE ELER-8-100HFE CEBU : MC Green PA CK500A
Wire / Clip	Au or Cu wire	Au or Cu wire

SOT-223

	Before Change	After Change
Leadframe	Cu-Ag Plated	Cu-Ag Plated
Die Attach	Eutectic, Solder	Solder
Mold Compound	AUK KR : NEPES LMC400SRM AMC CEBU : MC PA PLASKON AMC	SBN : G700HC Sumitomo CEBU : MC PA PLASKON AMC
Wire / Clip	Au wire	No Change

SC-70

	Before Change	After Change
Leadframe	Alloy42-Ag Plated	Alloy42-Ag Plated
Die Attach	Eutectic	Eutectic
Mold Compound	JCET : EDALE ELER-8-100HFE	LPS : Henkel M7A
Wire / Clip	Au wire	Cu wire



SSOT3

	Before Change	After Change
Leadframe	Cu-Ag Plated	Cu-Ag Plated
Die Attach	Eutectic	Eutectic
Mold Compound	CEBU : MC Green PA CK500A	SBN : G600 FB Sumitomo CEBU : MC Green PA CK500A
Wire / Clip	Au wire	No Change

NOTE: Part Details is attached.

To view attachments

1. Download pdf copy of the PCN to your computer
2. Open the downloaded pdf copy of the PCN
3. Click on the paper clip icon available on the menu provided in the left/bottom portion of the screen to reveal the Attachment field
4. Then click on the attached file

Reliability Data Summary:

QV DEVICE NAME : FSB560A-SN00165

RMS# : V58103

PACKAGE : SSOT3

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100 % max rated V	1008 hrs	0/231
H3TRB	JESD22-A101	Ta=85°C, 85% / 80% max rated V	1008 hrs	0/231
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs	0/231
UHASt	JESD22-A118	Ta= 130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/231
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to 150°C	1000 cyc	0/231
IOL	MIL STD750 (M1037) AEC Q101	Ta=+25°C, deltaTj=100°C On/Off = 2 min	15000 cyc	0/231
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C		
RSH	JESD22- B106	Ta = 260C, 10 sec		0/90

QV DEVICE NAME : KSA1013YBU

RMS# : S58609

PACKAGE : TO-92

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100 % max rated V	1008 hrs	0/231
H3TRB	JESD22-A101	Ta=85°C, 85% / 80% max rated V	1008 hrs	0/231
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs	0/231
UHASt	JESD22-A118	Ta= 130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/231
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to 150°C	1000 cyc	0/231
IOL	MIL STD750 (M1037) AEC Q101	Ta=+25°C, deltaTj=100°C On/Off = 2 min	15000 cyc	0/231
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C		



RSH	JESD22- B106	Ta = 260C, 10 sec	0/90
-----	--------------	-------------------	------

QV DEVICE NAME : NZT753

RMS# : S66353

PACKAGE : SOT-223

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100 % max rated V	1008 hrs	0/77
H3TRB	JESD22-A101	Ta=85°C, 85% / 80% max rated V	1008 hrs	0/77
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs	0/77
UHAST	JESD22-A118	Ta= 130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/77
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to 150°C	1000 cyc	0/77
IOL	MIL STD750 (M1037) AEC Q101	Ta=+25°C, deltaTj=100°C On/Off = 2 min	15000 cyc	0/77
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C		
RSH	JESD22- B106	Ta = 260C, 10 sec		0/30

QV DEVICE NAME : KSA1298YMTF

RMS# : L64532 / L64536

PACKAGE : SOT-23

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100 % max rated V	1008 hrs	0/231
HAST	JESD22-A110	Ta=130°C, 85% RH, 18.8psig, bias=100V	192 hrs	0/231
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs	0/231
UHAST	JESD22-A118	Ta= 130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/231
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to 150°C	1000 cyc	0/231
IOL	MIL STD750 (M1037) AEC Q101	Ta=+25°C, deltaTj=100°C On/Off = 2 min	15000 cyc	0/231
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C		
RSH	JESD22- B106	Ta = 260C, 10 sec		0/90

QV DEVICE NAME : NZT45H8

RMS# : S58619

PACKAGE : SOT-223

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100 % max rated V	1008 hrs	0/77
H3TRB	JESD22-A101	Ta=85°C, 85% / 80% max rated V	1008 hrs	0/77
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs	0/77
UHAST	JESD22-A118	Ta= 130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/77
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to 150°C	1000 cyc	0/77
IOL	MIL STD750 (M1037) AEC Q101	Ta=+25°C, deltaTj=100°C On/Off = 2 min	15000 cyc	0/77
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C		
RSH	JESD22- B106	Ta = 260C, 10 sec		0/30



QV DEVICE NAME : MMBD1505A

RMS# : L58111

PACKAGE : SOT-223

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100 % max rated V	1008 hrs	0/77
H3TRB	JESD22-A101	Ta=85°C, 85% / 80% max rated V	1008 hrs	0/77
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs	0/77
UHASt	JESD22-A118	Ta= 130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	264 hrs	0/77
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to 150°C	1000 cyc	0/77
IOL	MIL STD750 (M1037) AEC Q101	Ta=+25°C, deltaTj=100°C On/Off = 2 min	15000 cyc	0/77
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C		
RSH	JESD22- B106	Ta = 260C, 10 sec		0/30

QV DEVICE NAME : FJT44TF

RMS# : S58621

PACKAGE : SOT-223

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100 % max rated V	1008 hrs	0/77

Electrical Characteristics Summary:

No impact on other electrical test parameters.

KSA1298YMTF's ESD rating was noted to be lower on the qualification material. ON Semiconductor recognizes the importance of this rating in certain customer applications and will strive to improve prior to implementation.

List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the [PCN Customized Portal](#).

Part Number	Qualification Vehicle
FJT44KTF	FSB560A-SN00165, FJT44TF, NZT753
FJT44TF	FSB560A-SN00165, FJT44TF, NZT753
NZT560A	FSB560A-SN00165, NZT753
FZT649	FSB560A-SN00165, NZT753
NZT902	FSB560A-SN00165, FJT44TF, NZT753
NZT660	FSB560A-SN00165, KSA1013YBU, NZT753
FZT790A	FSB560A-SN00165, KSA1013YBU, NZT753
NZT660A	FSB560A-SN00165, KSA1013YBU, NZT753



BCP54	FSB560A-SN00165, NZT753
BCP55	FSB560A-SN00165, NZT753
NZT560	FSB560A-SN00165, NZT753
NZT605	FSB560A-SN00165, FJT44TF, NZT753
NZT7053	FSB560A-SN00165, FJT44TF, NZT753
NZT651	FSB560A-SN00165, NZT753
NZT751	FSB560A-SN00165, KSA1013YBU, NZT753
NZT753	FSB560A-SN00165, KSA1013YBU, NZT753
KSC3265YMTF	FSB560A-SN00165, MMBD1505A
KSA1298YMTF	KSA1298YMTF
MMBT5179	FSB560A-SN00165, MMBD1505A
MMBT81	FSB560A-SN00165, KSA1013YBU, MMBD1505A
FSB560A	FSB560A-SN00165
FSB649	FSB560A-SN00165
FSB660A	FSB560A-SN00165, KSA1013YBU
FSB560	FSB560A-SN00165
FJV1845FMTF	FSB560A-SN00165, FJT44TF, KSA1298YMTF
FJV992FMTF	FSB560A-SN00165, KSA1013YBU, KSA1298YMTF
PZTA29	FSB560A-SN00165, KSA1013YBU, NZT753
PZTA28	FSB560A-SN00165, KSA1013YBU, NZT753
NZT45H8	FSB560A-SN00165, KSA1013YBU, NZT45H8
NZT44H8	FSB560A-SN00165, NZT45H8
MMBTA28	FSB560A-SN00165, FJT44TF
MMBT100	FSB560A-SN00165, KSA1298YMTF
FJX992TF	FSB560A-SN00165, KSA1013YBU, KSA1298YMTF

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN24073X

発行日: 23 Jul 2021

変更件名:	オン・セミコンダクター 新潟ウエハ製造施設 (日本) の認定ならびに SOT-23、SSOT3、SOT-223、SC-70 パッケージの小信号トランジスタデバイスの組立およびテスト拠点のオペレーションの統合。	
初回出荷予定日:	2021 年 10 月 30 日またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前。	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または < Jason.Choy@onsemi.com > にお問い合わせください。	
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または < PCN.Samples@onsemi.com > にお問い合わせください。サンプルは、この変更の初回 PCN または最終 PCN の最初の通知の日付から 30 日以内に要求してください。サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。	
追加の信頼性データ:	お客さまの地域のオン・セミコンダクター営業所または < Yasuhiro.Igarashi@onsemi.com > にお問い合わせください。	
通知種別:	これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) です。FPCN は、変更実施の 90 日前に発行されます。オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 30 日以内に書面による問い合わせがない限り、この変更が承諾されたものとみなします。お問い合わせは、< PCN.Support@onsemi.com > 宛てにお願いします。	
変更部品の識別:	お客様は、FPCN の期間満了後またはお客様の承認があればその前から変更後品を受け取ります。新しい組立およびテスト拠点からの部品は、オン・セミコンダクターの表示フォーマットに従う製品表示により識別できます。	
変更カテゴリ:	テストの変更, 組立の変更, ウェハファブの変更	
変更サブカテゴリ:	製造拠点の移転	
影響を受ける拠点:		
オン・セミコンダクター拠点:	外部製造工場 / 下請業者拠点:	
Leshan Phoenix Semiconductor, China	AUK Corporation, Korea	
ON Semiconductor Cebu, Philippines	JCET, China	
ON Semiconductor Niigata, Japan	Phenitec Semiconductor, Japan	
ON Semiconductor Seremban, Malaysia		
説明および目的:	<p>この最終通知は、オン・セミコンダクター新潟 (日本) を認定し、SOT-23、SSOT3、SOT-223、SC-70 にパッケージされた小信号トランジスタの組立およびテスト拠点を統合することをお知らせするものです。</p> <p>この変更により、フェニテックの 5 インチ製造施設が閉鎖されることになりました。オン・セミコンダクター新潟とすべての組立およびテスト拠点は、ISO/TS 16949:2009 の認証を受けた既存のオン・セミコンダクター認定製造拠点です。</p> <p>本通知に記載されている製品は、従来どおり鉛フリー、ハロゲン化物フリーであり、RoHS に準拠しています。品質試験は、移管されたデバイスの信頼性が引き続きオン・セミコンダクターの基準以上となることを証明するように設計されています。</p>	



拠点の変更:

	変更前の表記	変更後の表記
ウエハ製造拠点	Phenittec Semiconductor, Japan	Niigata, Japan
組立拠点	Leshan Phoenix Semiconductor, China / JCET, China / AUK China / ON Semiconductor Cebu, Philippines	Leshan Phoenix Semiconductor, China / JCET, China / ON Semiconductor Cebu, Philippines / ON Semiconductor Seremban, Malaysia
最終テスト拠点	Leshan Phoenix Semiconductor, China / JCET, China / AUK China / ON Semiconductor Cebu, Philippines	Leshan Phoenix Semiconductor, China / JCET, China / ON Semiconductor Cebu, Philippines / ON Semiconductor Seremban, Malaysia

ファブでの変更:

	変更前の表記	変更後の表記
フロントメタルタイプ	Al or AlSi	No Change
バックメタルタイプ	AuAs, AuSb, TiNiAg, TiNiAgSn	Au, TiNiAg, TiNiAgSn

部品の変更:

SOT-23

	変更前の表記	変更後の表記
リードフレーム	Alloy42-Ag Plated	JCET / CEBU : Alloy42-Ag Plated LPS : Alloy42-Cu Plated
ダイ接着剤	Eutectic	Eutectic
モールド・コンパウンド	LPS : Sumitomo JCET : EDALE ELER-8-100HFE AUK : KCC KTMC1050GR CEBU : MC Green PA CK500A	LPS : Henkel M7A JCET : EDALE ELER-8-100HFE CEBU : MC Green PA CK500A
ワイヤ/クリップ	Au or Cu wire	Au or Cu wire

SOT-223

	変更前の表記	変更後の表記
リードフレーム	Cu-Ag Plated	Cu-Ag Plated
ダイ接着剤	Eutectic, Solder	Solder
モールド・コンパウンド	AUK KR : NEPES LMC400SRM AMC CEBU : MC PA PLASKON AMC	SBN : G700HC Sumitomo CEBU : MC PA PLASKON AMC
ワイヤ/クリップ	Au wire	No Change

SC-70

	変更前の表記	変更後の表記
リードフレーム	Alloy42-Ag Plated	Alloy42-Ag Plated
ダイ接着剤	Eutectic	Eutectic
モールド・コンパウンド	JCET : EDALE ELER-8-100HFE	LPS : Henkel M7A
ワイヤ/クリップ	Au wire	Cu wire



SSOT3

	変更前の表記	変更後の表記
リードフレーム	Cu-Ag Plated	Cu-Ag Plated
ダイ接着剤	Eutectic	Eutectic
モールド・コンパウンド	CEBU : MC Green PA CK500A	SBN : G600 FB Sumitomo CEBU : MC Green PA CK500A
ワイヤ/ クリップ	Au wire	No Change

注: 部品詳細が添付されています

1. ご使用のコンピューターにPDF 版のPCN をダウンロードします。
2. ダウンロードしたPDF 版のPCN を開きます。
3. 添付欄を見るには、画面左 / 下部分のメニュー上にあるクリップアイコンをクリックしてください。
4. 添付ファイルをクリックします

信頼性データの要約:

デバイス名: FSB560A-SN00165RMS: V58103パッケージ: SSOT3

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100 % max rated V	1008 hrs	0/231
H3TRB	JESD22-A101	Ta=85°C, 85% / 80% max rated V	1008 hrs	0/231
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs	0/231
UHASt	JESD22-A118	Ta= 130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/231
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to 150°C	1000 cyc	0/231
IOL	MIL STD750 (M1037) AEC Q101	Ta=+25°C, deltaTj=100°C On/Off = 2 min	15000 cyc	0/231
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C		
RSH	JESD22- B106	Ta = 260C, 10 sec		0/90

デバイス名: KSA1013YBURMS: S58609パッケージ: TO-92

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100 % max rated V	1008 hrs	0/231
H3TRB	JESD22-A101	Ta=85°C, 85% / 80% max rated V	1008 hrs	0/231
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs	0/231
UHASt	JESD22-A118	Ta= 130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/231
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to 150°C	1000 cyc	0/231
IOL	MIL STD750 (M1037) AEC Q101	Ta=+25°C, deltaTj=100°C On/Off = 2 min	15000 cyc	0/231
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C		
RSH	JESD22- B106	Ta = 260C, 10 sec		0/90

デバイス名: NZT753RMS: S66353パッケージ: SOT-223

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100 % max rated V	1008 hrs	0/77
H3TRB	JESD22-A101	Ta=85°C, 85% / 80% max rated V	1008 hrs	0/77
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs	0/77
UHASt	JESD22-A118	Ta= 130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/77
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to 150°C	1000 cyc	0/77
IOL	MIL STD750 (M1037) AEC Q101	Ta=+25°C, deltaTj=100°C On/Off = 2 min	15000 cyc	0/77
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C		
RSH	JESD22- B106	Ta = 260C, 10 sec		0/30

デバイス名: KSA1298YMTFRMS: L64532 / L64536パッケージ: SOT-23

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100 % max rated V	1008 hrs	0/231
HAST	JESD22-A110	Ta=130°C, 85% RH, 18.8psig, bias=100V	192 hrs	0/231
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs	0/231
UHASt	JESD22-A118	Ta= 130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/231
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to 150°C	1000 cyc	0/231
IOL	MIL STD750 (M1037) AEC Q101	Ta=+25°C, deltaTj=100°C On/Off = 2 min	15000 cyc	0/231
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C		
RSH	JESD22- B106	Ta = 260C, 10 sec		0/90

デバイス名: NZT45H8RMS: S58619パッケージ: SOT-223

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100 % max rated V	1008 hrs	0/77
H3TRB	JESD22-A101	Ta=85°C, 85% / 80% max rated V	1008 hrs	0/77
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs	0/77
UHASt	JESD22-A118	Ta= 130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/77
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to 150°C	1000 cyc	0/77
IOL	MIL STD750 (M1037) AEC Q101	Ta=+25°C, deltaTj=100°C On/Off = 2 min	15000 cyc	0/77
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C		
RSH	JESD22- B106	Ta = 260C, 10 sec		0/30

デバイス名: MMBD1505ARMS: L58111パッケージ: SOT-223

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100 % max rated V	1008 hrs	0/77
H3TRB	JESD22-A101	Ta=85°C, 85% / 80% max rated V	1008 hrs	0/77
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs	0/77
UHASt	JESD22-A118	Ta= 130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	264 hrs	0/77
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to 150°C	1000 cyc	0/77
IOL	MIL STD750 (M1037) AEC Q101	Ta=+25°C, deltaTj=100°C On/Off = 2 min	15000 cyc	0/77
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C		
RSH	JESD22- B106	Ta = 260C, 10 sec		0/30

デバイス名: FJT44TFRMS: S58621パッケージ: SOT-223

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100 % max rated V	1008 hrs	0/77

電気的特性の要約:

その他の電気試験パラメータに影響はありません。

KSA1298YMTF の ESD 定格は、認定材料ではより低くなることが確認されました。オン・セミコンダクターは、この定格が特定のお客様のアプリケーションには重要であることを認識しており、実装前に改善するように努めます。

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
FJT44KTF	FSB560A-SN00165, FJT44TF, NZT753
FJT44TF	FSB560A-SN00165, FJT44TF, NZT753
NZT560A	FSB560A-SN00165, NZT753
FZT649	FSB560A-SN00165, NZT753
NZT902	FSB560A-SN00165, FJT44TF, NZT753
NZT660	FSB560A-SN00165, KSA1013YBU, NZT753
FZT790A	FSB560A-SN00165, KSA1013YBU, NZT753
NZT660A	FSB560A-SN00165, KSA1013YBU, NZT753
BCP54	FSB560A-SN00165, NZT753



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN24073X

発行日: 23 Jul 2021

BCP55	FSB560A-SN00165, NZT753
NZT560	FSB560A-SN00165, NZT753
NZT605	FSB560A-SN00165, FJT44TF, NZT753
NZT7053	FSB560A-SN00165, FJT44TF, NZT753
NZT651	FSB560A-SN00165, NZT753
NZT751	FSB560A-SN00165, KSA1013YBU, NZT753
NZT753	FSB560A-SN00165, KSA1013YBU, NZT753
KSC3265YMTF	FSB560A-SN00165, MMBD1505A
KSA1298YMTF	KSA1298YMTF
MMBT5179	FSB560A-SN00165, MMBD1505A
MMBTH81	FSB560A-SN00165, KSA1013YBU, MMBD1505A
FSB560A	FSB560A-SN00165
FSB649	FSB560A-SN00165
FSB660A	FSB560A-SN00165, KSA1013YBU
FSB560	FSB560A-SN00165
FJV1845FMTF	FSB560A-SN00165, FJT44TF, KSA1298YMTF
FJV992FMTF	FSB560A-SN00165, KSA1013YBU, KSA1298YMTF
PZTA29	FSB560A-SN00165, KSA1013YBU, NZT753
PZTA28	FSB560A-SN00165, KSA1013YBU, NZT753
NZT45H8	FSB560A-SN00165, KSA1013YBU, NZT45H8
NZT44H8	FSB560A-SN00165, NZT45H8
MMBTA28	FSB560A-SN00165, FJT44TF
MMBT100	FSB560A-SN00165, KSA1298YMTF
FJX992TF	FSB560A-SN00165, KSA1013YBU, KSA1298YMTF



Appendix A: Changed Products

PCN#: FPCN24073X
Issue Date: Jul 23, 2021

Product	Customer Part Number	Qualification Vehicle	New Part Number	Replacement Supplier
FJV992FMTF		FSB560A-SN00165, KSA1013YBU, KSA1298YMTF		
FJV1845FMTF		FSB560A-SN00165, FJT44TF, KSA1298YMTF		
FSB560		FSB560A-SN00165		
FSB660A		FSB560A-SN00165, KSA1013YBU		
FSB649		FSB560A-SN00165		
FSB560A		FSB560A-SN00165		
MMBTH81		FSB560A-SN00165, KSA1013YBU, MMBD1505A		
MMBT5179		FSB560A-SN00165, MMBD1505A		
KSA1298YMTF		KSA1298YMTF		
KSC3265YMTF		FSB560A-SN00165, MMBD1505A		
FJT44KTF		FSB560A-SN00165, FJT44TF, NZT753		
FJT44TF		FSB560A-SN00165, FJT44TF, NZT753		
NZT560A		FSB560A-SN00165, NZT753		
FZT649		FSB560A-SN00165, NZT753		
NZT902		FSB560A-SN00165, FJT44TF, NZT753		
NZT660		FSB560A-SN00165, KSA1013YBU, NZT753		
FZT790A		FSB560A-SN00165, KSA1013YBU, NZT753		
NZT660A		FSB560A-SN00165, KSA1013YBU, NZT753		
BCP54		FSB560A-SN00165, NZT753		
BCP55		FSB560A-SN00165, NZT753		
NZT560		FSB560A-SN00165, NZT753		
NZT605		FSB560A-SN00165, FJT44TF, NZT753		
NZT7053		FSB560A-SN00165, FJT44TF, NZT753		
NZT651		FSB560A-SN00165, NZT753		
NZT753		FSB560A-SN00165, KSA1013YBU, NZT753		

**Appendix A: Changed Products****PCN#: FPCN24073X**
Issue Date: Jul 23, 2021

Product	Customer Part Number	Qualification Vehicle	New Part Number	Replacement Supplier
NZT751		FSB560A-SN00165, KSA1013YBU, NZT753		
PZTA28		FSB560A-SN00165, KSA1013YBU, NZT753		
PZTA29		FSB560A-SN00165, KSA1013YBU, NZT753		
NZT44H8		FSB560A-SN00165, NZT45H8		
NZT45H8		FSB560A-SN00165, KSA1013YBU, NZT45H8		
MMBTA28		FSB560A-SN00165, FJT44TF		
MMBT100		FSB560A-SN00165, KSA1298YMTF		
FJX992TF		FSB560A-SN00165, KSA1013YBU, KSA1298YMTF		